

### INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE TaC NA CINÉTICA DE SINTERIZAÇÃO E MICROESTRUTRURA DE COMPÓSITOS À BASE DE Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>

A.C.S.Coutinho, J.C.Bressiani, A.H.A.Bressiani IPEN – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares Av. Prof. Lineu Prestes, 2242 – Cidade Universitária São Paulo – SP - CEP. 05508-000

#### RESUMO

Cerâmicas à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> tem sido estudadas exaustivamente para aplicações estruturais e como ferramentas de corte. As excelentes propriedades mecânicas deste material são determinadas principalmente por suas características microestruturais e composição da fase presente nos contornos de grãos. A necessidade de melhoria na confiabilidade destes materiais para utilização em condições severas de uso levou ao desenvolvimento de compósitos particulados à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. A adição de uma segunda fase pode alterar os mecânismos de sinterização e promover alterações microestruturais. Neste trabalho a influência da adição de partículas de TaC durante a sinterização e a microestrutura resultante foram estudadas. Observou-se que a presença de partículas de TaC (até 20%vol.) possuem pouca influência na cinética de sinterização, produzindo compósitos com alta densidade (>95%DT) e microestrutura homogênea; as partículas de TaC permanecem nos contornos de grãos.

Palavras-chave: Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, Sinterização, Compósito,

#### INTRODUÇÃO

Cerâmicas covalentes são materiais que apresentam excelentes propriedades termo-mecânicas sendo de grande interesse para fins tecnológicos. Dentre as cerâmicas covalentes mais comuns, destacam-se o BN (nitreto de boro), o SiC e seus politipos e o Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, bastante estudado para aplicações estruturais ou como ferramentas de corte<sup>(1-6)</sup>.

A busca por materiais cerâmicos à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> que apresentem alta dureza associada a alta tenacidade à fratura é o objetivo da maioria das pesquisas<sup>(7-9)</sup>. A introdução de uma segunda fase às cerâmicas à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> se mostrou promissora para a obtenção de materiais com melhores propriedades para aplicações estruturais<sup>(10)</sup>. Entretanto, a obtenção de compósitos à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ainda é uma tarefa bastante complexa e dependendo da segunda fase adicionada, a obtenção de cerâmicas com alta densidade e boas propriedades termo-mecânicas requer a utilização de processos de sinterização com aplicação de alta pressão

associado com alta temperatura em atmosfera controlada, tornando o processamento difícil e com custos elevados. O principal sistema compósitos à base de  $Si_3N_4$  é o que utiliza o SiC como segunda fase, na forma de micro- ou nano-partícula, fibras ou plaquetas<sup>(3-10)</sup>.

O processo de sinterização do  $Si_3N_4$  é bastante complexo. Devido à natureza covalente das ligações químicas entre os átomos de Si e N, o coeficiente de auto difusão é baixo, sendo necessário o uso de aditivos de sinterização que formem um líquido durante a sinterização<sup>(11)</sup>. Os aditivos mais comuns são os óxidos metálicos e de terras raras, tais como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ou La<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>(12)</sup>.

Os aditivos de sinterização reagem com a sílica presente na superfície do pó de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> e formam um líquido que auxilia no rearranjo das partículas no primeiro estágio da sinterização. Com o aumento da temperatura, inicia-se o processo de solução da fase  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> no líquido e quando o líquido se torna supersaturado inicia-se a reprecipitação da fase  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub><sup>(13)</sup>.

A presença de partículas de segunda fase provoca alterações na cinética de sinterização do  $Si_3N_4$ : podem dificultar o rearranjo das partículas e o transporte de massa ou reagirem quimicamente com os constituintes do sistema<sup>(7)</sup>.

Neste trabalho, a cinética de sinterização, as fases presentes, após a sinterização, e a microestrutura do compósito  $Si_3N_4/TaC$ , obtido pela rota tradicional de processamento de pós, são estudadas.

#### PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Para a obtenção de compósitos à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> foi utilizada a rota tradicional de processamento de pós.  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (M11 – H.C. Starck, com 92,7% de  $\alpha$ -Si3N4), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (A16/SG – Alcoa) e Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Aldrich Chemical – USA) foram utilizados como matérias primas para obtenção do compósito Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/TaC com adição de 5, 10 e 20% vol. de TaC (H.C.Starck) como segunda fase.

Primeiramente foi preparada uma composição base (CB), constituída de 90% em massa de  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, 6% em massa de Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> e 4% em massa de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Esta composição foi moída em moinho de alta energia, por 4 horas, rotação de 300 rpm, com esferas, haste e vaso de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> e meio líquido para moagem álcool isopropílico. A suspensão obtida foi seca em rotoevaporador e o pó desaglomerado em malha ASTM 80. Os compósitos foram obtidos utilizando a mesma rota de preparação. À CB foram adicionados diferentes quantidades de TaC e após a desaglomeração, os pós foram compactadas por prensagem uniaxial (50MPa) e isostática à frio (200MPa). A densidade à verde dos compósitos foi determinada pelo método geométrico.

O estudo de cinética de sinterização foi realizado na amostra contendo 20%vol.TaC, compactada com diâmetro de 7mm e sinterizadas em dilatômetro (NETZSCH modelo DIL 402 E/7) a 1750°C por 1h, com taxa de aquecimento e resfriamento de 20 e  $30^{\circ}$ C/min, respectivamente. Foram utilizados tubo e haste de contato de grafite e fluxo de N<sub>2</sub>.

Tratamentos térmicos em diferentes temperaturas,  $1500^{\circ}$ C/1h,  $1600^{\circ}$ C/1h,  $1700^{\circ}$ C/1h,  $1750^{\circ}$ C/1h,  $1800^{\circ}$ C/1h e  $1750^{\circ}$ C/1h + $1850^{\circ}$ C/1h foram realizados em forno de resistência de grafite (Thermal Technologies, Santa Barbara, USA). As temperaturas dos patamares intermediários, nos tratamentos térmicos das amostras com 20% TaC, foram determinadas levando-se em consideração as temperaturas dos picos observados durante a sinterização assistida por dilatômetro. Todos os tratamentos foram realizados com cama protetora, CB, e pressão de N<sub>2</sub> (~5atm).

As medidas de densidade aparente foram realizadas pelo método de Archimedes, utilizando balança analítica, de acordo com a equação:

$$\rho = \frac{Ms}{Mu - Mi} \rho_{H_2 O}$$

Foram realizadas várias medidas de densidade em todas as amostras e o desvio padrão é menor que 0,01%.

As fases presentes foram determinadas por difração de raios X, nas amostras sinterizadas em forno de resistência de grafite e cortadas longitudinalmente, para obter resultados significativos do interior da amostra. Foram utilizados dois equipamentos para obtenção dos espectros de raios X: marca Bruker-AXS modelo D8 Advance e Rigaku, modelo DMAX 2000.

Para a análise microestrutural, por microscopia eletrônica de varredura (Philips, modelo XL 30), a superfície das amostras foi polida em suspensão de diamante até 1  $\mu$ m e atacada por plasma 2 CF<sub>4</sub>:1O<sub>2</sub>, em diferentes tempos, devido à diferença de composição e densidade dos compósitos.

#### **RESULTADOS E DISCUSSÃO**

Com os dados obtidos durante a sinterização assistida por dilatômetro foram traçadas curvas de retração linear e taxa de retração linear em função da temperatura. A Figura 1 apresenta a curva de retração linear em função da temperatura do compósito 20%vol.TaC e da CB.



Figura 1 - Retração linear em função da temperatura de compósitos à base de  $Si_3N_4$ : CB e CB+TaC

O comportamento observado, quanto à retração linear do compósito, é semelhante ao observado para a composição base. O início da retração ocorre aproximadamente na mesma temperatura e durante o patamar a 1750°C/1h, há retração.

A curva de taxa de retração linear, em função da temperatura, foi construída a partir da derivada da curva de retração linear. Comparando a curva de taxa de retração linear da CB com a curva do compósito, pode-se observar que a presença de partículas de TaC não interferem significativamente no processo de solução-reprecipitação. A única alteração observada na sinterização do compósito, devido à presença de partícula de segunda fase foi em relação à temperatura em que ocorre a solução-reprecipitação (Figura 2). Para a CB a solução-reprecipitação ocorre em ~1600°C, enquanto que para o compósito ocorre em ~1570°C.



Figura 2 – Taxa de retração linear e densidade relativa em função da temperatura de compósitos à base de  $Si_3N_4$ : CB e CB+TaC

O efeito da adição de diferentes proporções de TaC foi estudada por sinterização normal. Amostras com 5, 10 e 20% em volume de TaC foram sinterizadas a 1750°C e 1800°C, por 1 hora, em forno de resistência de grafite. As densidades dos compósitos obtidas (Tabela 1) apresentam uma pequena diminuição com o aumento da quantidade de TaC adicionada, mas mesmo com adições de 20% em volume, a densidade obtida é elevada. A perda de massa observada é praticamente constante e provavelmente se deve a volatilização dos aditivos óxidos de sinterização.

		SINTERIZAÇÃO					
			1750°C/1h		1800°C/1h		
Amostra	Dt (g/cm³)	%Dt	Perda de massa (%)	%Dt	Perda de massa (%)		
CB	3.30	97	2.1	98	3.0		
CB+5%vTaC	3,83	96	3,2	98	4,4		
CB+10%vTaC	4.36	96	1.7	97	2.7		
CB+20%vTaC	5.42	94	1.9	97	2.9		

Tabela 1 – Densidade relativa dos compósitos Si $_3N_4$ /TaC sinterizados em forno de resistência de grafite.

A análise por difração de raios X (Figura 1, 2 e 3) indica que após a sinterização do compósito, as fases presentes são  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, TaC e fases devido a cristalização dos aditivos de sinterização. A presença de fases cristalinas devido a cristalização do líquido ocorreu nos compósitos com 5, 10 e 20%vol. TaC. A formação destas fases, do sistema Y-SiAION, é prevista pelos diagramas de

equilíbrio do sistema Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. A fase Y<sub>10</sub>Al<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>18</sub>N<sub>4</sub> foi descoberta em 1975 por R.J.Wills, após a sinterização de nitreto de silício com adição de alumina e ítria como aditivos<sup>(12)</sup>. A formação da fase Y<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>N<sub>6</sub>, identificada anteriormente por Ekström et al<sup>(13)</sup>, está relacionada com a presença de pequenas quantidades de carbono. O carbono reduz o oxigênio, e em atmosfera rica em nitrogênio favorece a formação de compostos no sistema Si-Y. Essa fase cristaliza-se em temperatura de aproximadamente 1400°C. A quantidade de carbono livre no pó TaC, segundo o fabricante, é aproximadamente 0,25%. Esse carbono deve reagir com o oxigênio, provocando a formação de Y<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>N<sub>6</sub>.

A hipótese proposta para a boa densificação deste compósito está relacionada a formação da fase  $Y_2Si_3N_6$ . O carbono reage com o oxigênio do líquido para formar a fase  $Y_2Si_3N_6$  e modifica a razão  $Y_2O_3/Al_2O_3^{(14)}$ . Com a mudança desta razão, a molhabilidade se altera<sup>(14)</sup> e pode modificar o processo de solução-reprecipitação, em comparação com a CB.

Um aspecto importante a ser considerado refere-se a diferença de intensidade observada entre os picos das fases TaC e  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, conseqüência da diferença de raio iônico entre os átomos Si, N, C e Ta<sup>(15)</sup>.



Figura 1 – Difratograma do compósito com 5% vol. TaC, sinterizado a 1750°C/1h e 1800°C/1h



Figura 2 – Difratogramas do compósito com 10% vol. TaC, sinterizados a 1750°C/1h e a 1800°C/1h



Figura 3 – Difratogramas dos compósitos com 20%vol de TaC, sinterizados a 1750°C/1h e 1800°C/1h

Foram realizados vários tratamentos térmicos, na faixa de temperatura de 1400°C a 1850°C, nas amostras com 20% em volume de TaC, com objetivo de analisar os fenômenos que ocorrem durante a sinterização deste compósito. A densidade do compósito apresenta comportamento semelhante ao da CB (Tabela 2). Observa-se que após o tratamento a 1400°C/1h a densidade do compósito é superior à densidade da CB, entretanto a densidade do compósito após o tratamento a 1500°C/1h é inferior à da CB. Essa diferença permanece praticamente constante em todos os tratamentos até 1800°C/1h. Esta diferença deve estar associada à dificuldade mecânica que as partículas de TaC impõe ao processo de solução-reprecipitação no compósito. A densidade do compósito após o tratamento a

1800°C/1h é muito semelhante à densidade observada na CB após o mesmo tratamento.

A perda de massa do compósito e da composição base é bastante semelhante e aumenta com o aumento da temperatura de sinterização.

	Composição				
<b>.</b>	СВ		20%vol TaC		
Tratamento Termico	Dt (%Dt)	Perda de massa (%)	Dt (%Dt)	Perda de massa (%)	
1400°C/1h	68	0,4	70	0,7	
1500°C/1h	84	1,8	82	0,9	
1600°C/1h	92	2,0	90	1,0	
1700°C/1h	97	1,3	94	1,6	
1750°C/1h	97	2,1	94	1,9	
1800°C/1h	98	3,0	97	2,9	
1750°C/1h+1850°C/1h	98	6,3	99	3,8	

Tabela 2 – Densidade relativas obtidas após tratamentos térmicos em várias temperaturas

Não houve interação entre o TaC com os aditivos de sinterização ou com o  $Si_3N_4$  (Figura 4 (a)), ou seja, o TaC é inerte quimicamente. Após o tratamento a 1500°C, observam-se picos das fases  $\alpha \in \beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> e com o aumento da temperatura, a fase  $\alpha$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> se transforma em  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> e só a fase  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> e TaC estão presentes nas amostras tratadas termicamente em temperaturas mais elevadas. Após os tratamentos térmicos a 1500°C/1h e a 1600°C/1h, a fase Y<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> foi identificada (Figura 4). Esta fase é prevista pelo diagrama quaternário Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-YN (Figura 5) e pelo binário Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> (Figura 6). A fase Y<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>O<sub>7</sub> deve se formar em temperatura acima de 1500°C, de acordo com o diagrama binário Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>, por reação no estado sólido<sup>(16)</sup>.







Figura 5 – Isotermas a 1550°C do sistema Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-SiO<sub>2</sub>-Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-YN<sup>(16)</sup>

A análise microestrutural dos compósitos foi realizada por microscopia eletrônica de varredura na superfície polida e atacada por plasma  $2CF_4:1O_2$ . As microestruturas da composição base e dos compósitos são apresentadas nas Figura 7, 10, 11 e 12.

A microestrutura observada por microscopia eletrônica de varredura é típica de cerâmicas à base de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>: grãos alongados de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, dispersos em uma fase formada pelos aditivos de sinterização. Nos compósitos pode-se observar a presença de grãos alongados de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, semelhantes aos grãos observados na composição base, e partículas de TaC nos contornos de grãos. A presença de TaC faz com que os grãos de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> sejam menores que os observados na composição base.



Figura 6 – Diagrama binário do sistema Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> <sup>(17)</sup>

Observa-se que a distribuição dos grãos de TaC se apresenta homogênea (Figura 8 a 12), indicando que houve boa molhabilidade do líquido nas partículas durante a sinterização. Em algumas regiões dos compósitos com adições de 10 e 20% vol. é possível observar que as partículas de segunda fase bloqueiam o crescimento dos grãos de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (indicadas nas Figura 9 e 12). Alguns grãos de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> apresentam a estrutura do tipo "core-rim", resultantes da nucleação heterogênea. O crescimento de grãos  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> também é obstruído por outros grãos de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Nas micrografias pode-se observar a obstrução esférica dos grãos de  $\beta$ -Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (Figura 7).



Figura 7 - Microscopia eletrônica de varredura da CB, sinterizada a 1750°C/1h. A região em destaque indica a estrutura do tipo "core-rim".



Figura 8 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra 5%TaC sinterizada a 1800°C/1h



Figura 9 – Microscopia eletrônica de varredura das amostras: (a) CB+10%TaC sinterizada a 1750°C/1h; (b) 10%TaC sinterizada a 1800°C/1h. A região em destaque indica que a presença de partículas de TaC dificultam o crescimento de grãos.



Figura 10 – Microscopia eletrônica de varredura das amostras: (a) CB+20%TaC sinterizada a 1750°C/1h; (b) 20%TaC sinterizada a 1800°C/1h

#### CONCLUSÕES

As partículas de TaC não interfere significativamente no processo de sinterização. A alteração observada foi na temperatura em que ocorre a máxima taxa de retração devido a solução-reprecipitação do compósito. Durante os

tratamentos térmicos, o TaC é uma fase inerte, permitindo a obtenção de microestruturas homogêneas com adições de até 20%vol. TaC. A boa densidade obtida neste compósito pode estar associada à formação da fase  $Y_2Si_3N_6$ .

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. H. Yamamoto, K. Akiyama, Y. Murakami; J. Euro. Ceram. Soc., 26, 6 (2006) 1059.

2. M. Mitomo, In M. Mitomo, "Silicon Nitride-1, Ceramics Research and Development in Japan, Elsevier Applied Science, 1989.

3. H.D. Kim, Y.J. Park, B. P. Han, M.W.Park, W.T. Bae, Y.W.Kim, H.T.Lin, P.F.Becher, Scripta Materialia, 54, 4 (2006) 615.

4. R.G.Duan, G.Roebben, J.Vleugels, O.Van de Biest, Scripta Materialia, 53, 6 (2005) 669.

5.Vučković, S. Bošković, B. Matović, M. Vlajic, V. Krstic, Ceram. Inter., 32, 3 (2006) 303.

6.Z. Tatli, D.P.Thompson, Mater. Lett. 59, 14-15 (2005) 1897.

7.M.J. Hoffmann, G. Petzow, Pure & Appl. Chem., 66, 9 (1994) 1807.

8.Y. Tajima, Mat. Res. Soc. Symp., Proc. 287, (1993) 189.

9.J. Song, D.O'Sullivan, R. Flynn, S. Hampshire, Key Eng. Mat., 86-87, 263-270, 1993 in "Engineered Materials", Eds. S. Hampshire, M. Buggy, and A.J. Carr., Trans. Tech. Publications, Switzerland.

10.J-F.Yang, T.Ohji, T.Sekino, C-L.Li, K.Niihara, J.Euro.Ceram.Soc., 21, 12 (2001) 2179.

11.M. Mitomo, In M. Mitomo, "Silicon Nitride-1, Ceramics Research and Development in Japan, Elsevier Applied Science, 1989.

12. R.J. Wills, J.Am.Ceram.Soc., 64, C96-C97, 1981.

13. T.C.Ekström, K.J.D.MacKenzie, M.J.Ryan, I.W.M.Brown, G.V. White; J. Mater. Chem., 7, 505-509, 1997.

14. J. Chen, P.Wei, Q.Mei, Y.Huang, J.Euro. Ceram.Soc., 20, 2685-2689, 2000

15. B.D.Cullity, "Elements of X ray diffraction", Ed. Addison Wesley, 1978.

16. Tien, T.Y., "Use of phase diagram in the study of silicon nitride ceramics", 127-156, IN "Phase diagrams in Advanced Ceramics", Ed. by Allen M. Alper, Academic Press, 1995.

17. "Phase Equilibria Diagrams" Demo CD–ROM Database – Version 3.0, "The American Ceramic Society".

# INFLUENCE OF TaC ADDITION ON SINTERING KINETICS AND MICROSTRUCTURE OF Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> BASED COMPOSITES

 $Si_3N_4$  based ceramics have been widely studied for structural application and as cutting tools. Room temperature properties of  $Si_3N_4$  ceramics are mainly determined by microstructure characteristics, aspect ratio and grain size of  $\beta$ - $Si_3N_4$  and high-temperature strength is controlled particularly by the characteristics of grain boundary phase. The need for further improvement in the mechanical reliability of  $Si_3N_4$  has led to the development of particulate  $Si_3N_4$  based ceramics composites. The addition of a reinforcing phase may change the sintering behavior of  $Si_3N_4$  and its microstructure. In the present study the influence of particulate TaC during sintering and microstructure of  $Si_3N_4$  composites were investigated by dilatometry, XRD and SEM. The presence of TaC particles has small influence on

sintering kinetics. In comparison with monolithic  $Si_3N_4$  ceramics, composites produce homogeneous microstructure, with TaC particles at grain boundary.

Key-words: silicon nitride, sintering, particulate composite